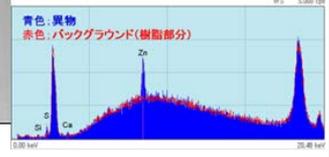


八戸工業研究所所有装置

名称	X線分析顕微鏡	メーカー	(株)堀場製作所	型式	XGT-7200AHT1	取得	H27
概要	空間分解能10 μ mの微小領域を分析できる、顕微鏡タイプのエネルギー分散型蛍光X線分析装置です。金属やセラミックス等の工業材料や電子部品等の定性分析や電子基板や樹脂にめっきした部品などのマッピング分析による元素分布と透過観察を同時に可能です。						
応用事例	<ul style="list-style-type: none"> • わからなくなった金属・セラミックス材料の同定や比較(同一物質であるかなど)。 • 異物(無機系)がどのような物質であるか。材料の表面に小さく存在する異物も。 • 電子基板などの故障原因の調査(X線透視観察と定性分析や異物分析を行う) 						
主な仕様	<ul style="list-style-type: none"> • Rhターゲット、•管電流50kV/1mA、•SDD半導体検出器、•集光方式:X線導管、•空間分解能:10μm •測定元素範囲:Na~U、•最大試料サイズ 340×250×80(H)で100(W)×100(D)の範囲を測定 •X線透過機能:あり(樹脂や基板の透視観察可能)、•試料室雰囲気:大気または真空 						
測定時間	<ul style="list-style-type: none"> •点測定:15~1800秒/点 •マッピング測定:15分~ 	 <p>元素分析(異物分析) 微小な異物をスポット分析</p> <p>光学顕微鏡×100倍像</p>  					
出力形態	<ul style="list-style-type: none"> •PDFファイルまたは印刷物 •メーカー独自フォーマット 						
試料等の制約	<ul style="list-style-type: none"> •凹凸が激しい試料(分析焦点を合わせるため試料と検出部の隙間が10mm以下とする必要があります) •液体・粉体はご相談ください。 •透過機能は樹脂、アルミなど2mm程度の板状試料で可能です。 						
使用料 手数料	機械使用: 4,350 円/時間 依頼試験: 定性分析 3,000円/件、マッピング分析 8,900円/件						
機械使用予約・お問い合わせ 八戸工業研究所 技術支援部 TEL: 0178-21-2100, FAX: 0178-21-2101 e-mail: kou_hachinohe@aomori-itc.or.jp 本装置は地域オープンイノベーション促進事業(経済産業省)により導入しました。							